上海大学 计算机学院 《数字逻辑实验》报告 7

姓名 ___严昕宇___ 学号 __20121802_

时间 周四 10-12 机位 24 指导教师 刘学民

实验名称: 中规模元件及综合设计

一、实验目的

- 1. 使用计数器 74LS161 芯片,用反馈置数法或清零法构造模 10 计数器,并测试其功能;
- 2.使用计数器、译码器或其他中规模组合逻辑部件,设计一个二进制序列 01100111 发生器,在 Quartus II 中根据逻辑图接线并仿真测试后,下载到 FPGA 进行硬件测试。

二、实验原理

依据《数字逻辑实验指导书》P.实验-60 等相关内容

三、实验内容

1. 实验任务一(中规模时序元件测试)

- (1) 实验步骤
 - ① 用计数器 74LS161 芯片,用反馈置数法或清零法构造模 10 计数器,其逻辑电路图如下(此处以反馈置数法为例)

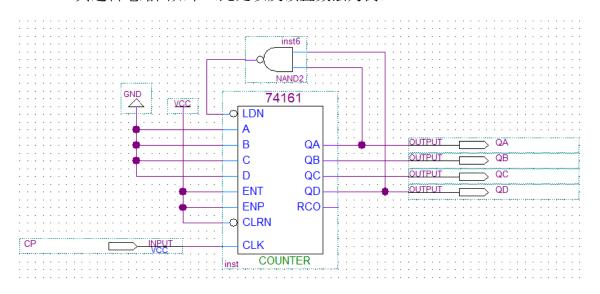


图 1 模 10 计数器

② 在 Quartus II 中创建文件夹与工程文件,创建一个图形文件,画出逻辑电路图,并用软件进行模拟测试,其结果如下;

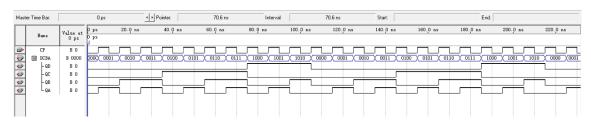


图 2 用 Quartus II 进行的波形时序仿真

- ③ 按照图 1 连接逻辑电路图,CP 接时钟的脉冲信号; Q_A 、 Q_B 、 Q_C 和 Q_D 接输出信号的数码显示管;
- ④ 逻辑功能测试 输入连续脉冲,测试其功能,观察数码显示管的变化。

(2) 实验现象

每当输入一个脉冲,计数器将按加1规律变化,到9以后回到0重新按加1规律变化,并重复此循环。

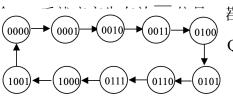
输入脉冲序号	Q_{D}	Qc	Q_{B}	QA	实验现象 [数码管显示]
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9
10	0	0	0	0	0

表 1 模 10 计数器实验现象记录表

(3) 数据记录、分析与处理

反馈置数法是通过反馈产生置数信号 \overline{LD} ,將预置数 $D_3D_2D_1D_0$ 预置到输出端。74LS161 是同步置数的,需 \overline{CP} 和 \overline{LD} 都有效才能置数,因此 \overline{LD} 应先于

CP 出现。所以 M-1 个数作为计数状态,变为低电平。



若用四位二进制数前 12 $Q_2Q_1Q_0=1001$ 时预置端

(4) 实验结论

根据实验数据可知,成功使用 74LS161 芯片,完成了模 10 计数器的 搭建与测试,与理论一致。

2. 实验任务二 (综合设计)

- (1) 实验步骤
 - ① 在 Quartus II 中,使用数据选择器 74LS151 和计数器 74LS161,构成二进制序列 01100111 发生器,其逻辑电路图如图 2 所示。

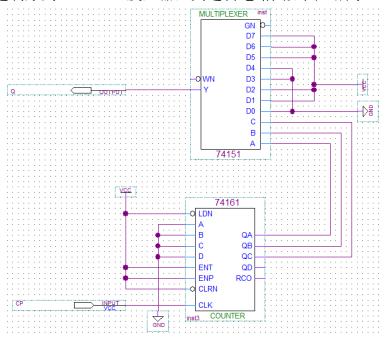


图 3 用 Quartus II 画出的逻辑电路图

- ② 选择器件型号,定义 FPGA 的 IO 管脚功能,如定义时钟 CP 端为 8,输出端 Q 为 9;
- ③ 用模拟工具对步骤 1 创建的图像文件进行模拟测试,并用编译工具编译:

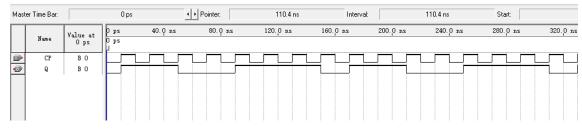


图 4 用 Quartus II 进行的波形时序仿真

- ⑥ 连接数据线,下载设计的电路到 FPGA;
- ⑦ 根据附录 B 中的 DICE-SEM II 实验箱与 EP1K10、EP1K30 引脚对照表,时钟 CP 对应 11,连接时钟脉冲信号;输出端 O 对应 12,将输出端

发光数码显示管。用开关和数码显示管测试 FPGA 的功能;

⑧ 观察数码显示管的变化,填写表 3:

(2) 实验现象

表 3 二进制序列 01100111 发生器

输入脉冲序号	实验现象 [数码管显示]		
0	0		
1	1		
2	1		
3	0		
4	0		
5	1		
6	1		
7	1		
8	0		
9	1		
10	1		

(3) 实验结论

根据实验数据可知,成功使用数据选择器 74LS151 和计数器 74LS161,构成二进制序列 *01100111* 发生器。

四、建议和体会

通过本次实验,使我进一步理解了计数器和数据选择器的原理,并学习了用掌握用计数器 74LS161 芯片构造模 10 计数器、用数据选择器 74LS151 和计数器 74LS161,构成二进制序列 01100111 发生器。并且在构造模 10 计数器时,我也学习到了反馈置数法或清零法两种不同的方法,扩展了我的知识面与眼界。在此次实验中,也继续尝试使用了 DICE-SEMII实验箱上的数码显示管,体会到了其方便性。

在这次实验中,我不仅学习了解了芯片的功能,而且也发现,实验箱上会存在许多芯片或者按钮出现故障或者失灵的问题。实践中没有出现问题是不可能的,我们必须有随机应变的能力,通过不断的试错,才能够完成目标。

虽然这是最后一次数字逻辑实验课,但是数字逻辑实验课给我带来的收获颇 丰,并且将启发我之后的其他课程学习。

同时在此,我也想感谢刘学民老师在七周课程中对我的指导与帮助!